

# WL27H Series

Automated Test Equipment

ミックスドシグナルLSIテストシステム

Mixed-signal LSI Test System

## 概要

車載用LSIや各種パワーデバイスの製品用途の多様化により、ますます高電圧・大電流かつ高精度な測定試験ができるテストシステムを要求されています。

WL27Hは、これらのニーズを満たしながら、開発から生産までの工程に対応できる柔軟性とコストパフォーマンスを追求したアナログ・ミックスドLSIテストシステムです。WL27Hの基本システムは、最大256ピンのデジタルI/Oと最大256ピンのパーピンDCを搭載し、車載用LSIや各種パワーデバイスの測定、さらにオプションのDSP Moduleを搭載することにより、ADC/DACのリニアリティ測定を高効率で実現できます。

プログラミング言語にはC言語に準拠した計測用C言語を開発し、また、ワークステーションはオフライン環境にて、プログラム作成、コンパイルによるデバッグを単独で行うことが可能です。

## 特長

- 同時測定機能
  - 1/2/4/8/16 DUTs 同時測定
  - パワーデバイスの4個同時測定 (4DGS)
  - 2ステーションでの交互試験
- 高測定精度
  - DC測定精度:  $\pm 0.05\%$
  - ノイズ提言のためのモジュールとシステム電源の分離
- オペレーティング環境
  - 2台のCPUとWindows GUI
  - 計測用C言語ベースのシステムソフト
  - デバッグツール
  - オフライン環境でのプログラム作成やコンパイル作業
- フレキシブルなシステム構築
  - 豊富な種類のV/Iソース
  - タイム、DSP、ファンクション各オプションの追装が可能

## 規格

- パーピンソース 最大 256 ピン ( $\pm 32\text{ V}/\pm 32\text{ mA}$ )
- デジタルI/Oピン 最大 256 ピン ( $-2\text{ V} \sim +8\text{ V}$ )
- デジタルI/Oブースタンプ出力
  - 最大 32 ピン ( $-5\text{ V} \sim +18\text{ V}$ )
- ファンクションテストレート
  - 20/40/60 MHz
  - パーピンTG、16 MW Vector Memory
- DCボルトメータ 2入力
  - $\pm 32\text{ V max. (Direct input)}$
  - $\pm 512\text{ V max. (ATT. input)}$
- V/Iソース
  - $\pm 50\text{ V}/\pm 250\text{ mA}$
  - $\pm 128\text{ V}/\pm 250\text{ mA} (\pm 40\text{ V}/\pm 2\text{ A})$
- パワーV/Iソース
  - $\pm 30\text{ V}/\pm 30\text{ A}$
  - $\pm 60\text{ V}/\pm 10\text{ A}$
- ハイボルテージV/Iソース
  - $-500\text{ V} \sim +800\text{ V}/\pm 200\text{ mA}$
- タイムモジュール
  - 10 nsec $\sim$ 6 sec (測定分解能 100 psec)
- DSPモジュール
  - AFG: 16 bits/10 Msps
  - ADGT: 16 bits/10 Msps
  - VFG: 14 bits/240 Msps
  - VDGT: 14 bits/80 Msps
- 同時測定数
  - 1/2/4/8/16 DUTs
  - (DSP使用時は、最大4/DUTs)

## ターゲットデバイス

車載IC、モータドライバIC、MCU、IPD

WL27H.1.01.YO

# WL27 Series

Automated Test Equipment

ミックスドシグナルLSIテストシステム

Mixed-signal LSI Test System

## 概要

WL27は開発から生産までの工程に対応できる柔軟性と拡張性があり、コストパフォーマンスを追及したアナログ・ミックスドLSIテストシステムです。アドバンスド・アナログLSIやパワーデバイス、車載用IC、デジタル・コンシューマLSI等の広範囲なミックスドLSIに最適なソリューションを提供します。

WL27の基本システムは、最大128ピンのデジタルI/Oと最大128ピンのパーピンDCを搭載することができ、さらにオプションDSPモジュールを搭載することにより、ADC/DACのリニアリティ測定を高速・高精度に測定できるシステムです。

ソフトウェアはC言語に準拠した計測用C言語を独自開発しワークステーション(EWS)上で強力なツールとなります。



## 特長

- 同時測定機能
  - 1/2/4/8/16 DUTs 同時測定
  - パワーデバイスの4個同時測定 (4DGS)
  - 2ステーションでの交互試験
- 高測定精度
  - DC測定精度:  $\pm 0.05\%$
  - ノイズ提言のためのモジュールとシステム電源の分離
- オペレーティング環境
  - 2台のCPUとWindows GUI
  - 計測用C言語ベースのシステムソフト
  - デバッグツール
  - オフライン環境でのプログラム作成やコンパイル作業
- フレキシブルなシステム構築
  - 豊富な種類のV/Iソース
  - タイム、DSP、ファンクション各オプションの追装が可能

## 規格

- パーピンソース 最大 128 ピン ( $\pm 32\text{ V}/\pm 32\text{ mA}$ )
- デジタルI/Oピン 最大 128 ピン ( $-2\text{ V} \sim +8\text{ V}$ )
- デジタルI/Oブースタンプ出力
  - 最大 32 ピン ( $-5\text{ V} \sim +18\text{ V}$ )
- ファンクションテストレート
  - 20/40/60 MHz
  - パーピンTG、16M Vector Memory
- DC ボルトメータ 2入力
  - $\pm 32\text{ V max. (Direct input)}$
  - $\pm 512\text{ V max. (Diff., ATT. input)}$
- V/Iソース
  - $\pm 50\text{ V}/\pm 250\text{ mA}$
  - $\pm 128\text{ V}/\pm 250\text{ mA} (\pm 40\text{ V}/\pm 2\text{ A})$
- パワーV/Iソース
  - $\pm 30\text{ V}/\pm 30\text{ A}$
  - $\pm 60\text{ V}/\pm 10\text{ A}$
- ハイボルテージV/Iソース
  - $-500\text{ V} \sim +800\text{ V}/\pm 200\text{ mA}$
- タイムモジュール
  - 10 nsec  $\sim$  6 sec (測定分解能 100 psec)
- DSPモジュール
  - AFG: 16 bits/10 Msps
  - ADGT: 16 bits/10 Msps
  - VFG: 14 bits/240 Msps
  - VDGT: 14 bits/80 Msps
- 同時測定数 1/2/4/8 DUTs

## ターゲットデバイス

車載IC、モータドライバIC、MCU、IPD

WL27.1.01.YO